## 01;07 Многоволновая дифракция рентгеновского параметрического излучения

© Н.В. Шипов

Московский государственный университет леса, Москва, Россия (Поступило в Редакцию 29 января 1996 г.)

Параметрическое рентгеновское излучение, обусловленное периодической структурой кристалла, ввиду высокой симметрии кристалла часто оказывается в условиях многоволновой дифракции [1,2] (четырехлучевая и восьмилучевая дифракция в эксперименте [2]). В отличие от симметричных спектральных и угловых распределений, рассчитанных в двухволновом приближении [3,4], в режиме многоволновой дифракции характерно появление узких и высоких максимумов, а сами распределения (эксперимент [2]) оказываются резко асимметричными.

Интенсивность излучения может быть найдена интегрированием решений граничной задачи для однородных уравнений Максвелла на больших расстояниях от кристалла [3,5]. Однако решение граничной рентгенооптической задачи в условиях многоволновой дифракции возможно только для отдельных геометрий и выделенных направлений [6], поэтому возможны только численные расчеты [5]. С другой стороны, интенсивность излучения с единицы длины траектории частицы (радиационные потери) находится интегрированием неоднородных уравнений без решения граничной задачи, что было кратко изложено на примере двухволнового приближения в [4]. Оба подхода дают сходные результаты, а при переходе к случаю тонкого кристалла [3], когда одна из амплитуд двухволнового приближения дает малый вклад в интенсивность, совпадают полностью [4].

В настоящей работе анализируются радиационные потери на параметрическое рентгеновское излучение в условиях трехволновой дифракции, развиваются и обосновываются методы интегрирования для последующих применений в режиме многоволновой дифракции, в том числе и для корректных численных расчетов. В компланарном случае, когда плоскости реакций  $k_0$ ,  $k_1$  и  $k_0$ , ,  $k_2$ оказываются в плоскости волновых векторов обратной решетки  $\tau_1$ ,  $\tau_2$ ,  $\tau_3$ , образующих правильный треугольник (рис. 1), система неоднородных уравнений для фурьеамплитуд  $E_0$ ,  $E_1$ ,  $E_2$  распадается на две отдельные системы для каждого состояния поляризации  $s = \pi$  или  $s = \sigma$  (орт  $\sigma$  перпендикулярен плоскости  $k_0$ ,  $k_1$ )

$$(1 + g_0 - k^2 c^2 / \omega^2) E_{0s} + c_s g(\bar{\tau}_1) E_{1s} + c_s g(\bar{\tau}_3) E_{2s} = 8\pi^2 i e v \theta p_s \delta(\omega - k_0 v) / \omega, c_s g(\bar{\tau}_1) E_{0s} + (1 + g_0 - k_1^2 c^2 / \omega^2) E_{1s} + c_s g(\bar{\tau}_2) E_{2s} = 0, c_s g(\bar{\tau}_3) E_{0s} + c_s g(\bar{\tau}_2) E_{1s} + (1 + g_0 - k_2^2 c^2 / \omega^2) E_{2s} = 0,$$
(1)

где  $p_{\sigma} = \sin \phi$ ,  $p_{\pi} = \cos \phi$ ,  $c_{\sigma}$ ,  $c_{\pi} = \cos 2\theta_{B}$ ,  $\theta_{B} = 60^{\circ}$ ;  $\theta$  и  $\phi$  — полярный и азимутальный углы вектора  $k_{0}$ (рис. 1); e и v — заряд и скорость частицы;  $g_{0} = g'_{0} + ig''_{0}$ ,  $g(\tau) = g'(\tau) + ig''(\tau)$  — пространственные фурьеамплитуды поляризуемости кристалла;  $g'(\tau)$  и  $g''(\tau)$  действительная и мнимая составляющие  $g(\tau)$ .

Поглощение считается слабым  $g'' \ll |g'|$ , причем в одноатомном кристалле  $g'(\tau) < 0$ ,  $g''(\tau) = g''_0 e^{-W}$ , где  $e^{-W}$  — фактор Дебая–Уоллера. В центросимметричных кристаллах, например Ge и Si, поляризуемости  $g(\tau_1)$ ,  $g(\tau_2)$ ,  $g(\tau_3)$  оказываются отличными от нуля и совпадающими при h + k + l = 4n, где  $\tau = 2\pi(h, k, l)$  [6].

Из условия обращения в бесконечность (при малом поглощении) амплитуд  $E_0$ ,  $E_1$ ,  $E_2$  находим угол  $\theta = \theta_0(\phi)$  испускания излучения в зависимости от азимута  $\phi$ , определяющий конус параметрического рентгеновского излучения (рис. 1),

$$3\theta^{2}\cos^{2}\phi = \left[\theta^{2} - \nu - c_{s}^{2}g^{2}\left(z_{0} + \theta^{2}\right)^{-1}\right]^{2} - c_{s}^{2}g^{2}\left[1 + c_{s}g\left(z_{0} + \theta^{2}\right)^{-1}\right]^{2}, \quad (2)$$

где  $z_0 = \gamma^{-2} - g'_0; \nu = 3(\omega - \omega_B)/\omega_B + g'_0 + \gamma^{-2}/2;$   $\omega_B = c\tau/2\sin\theta_B; g = g'(\tau); \gamma$  — лоренц-фактор частицы, который предполагается не малой величиной  $\gamma^{-2} \leq |g|.$ 

Если частота излучения не слишком близка к $\omega_B$ , когда частотная отстройка  $\nu$ оказывается полядка  $\sqrt{|g|}\sim 10^{-3},$ для угла  $\theta_0$  получаем

$$\theta_0 = |\nu|/\sqrt{3}|\cos\phi| \sim \sqrt{|g|}.$$
 (3)

Таким образом, для указанных частот  $\nu \sim \sqrt{|g|}$  излучение возможно как для верхней части конуса  $|\phi| < \pi/2$ , так и для нижней части  $|\phi| > \pi/2$ , где оно было невозможно при  $\nu > 0$  в условиях двухлучевой дифракции [4]. Это обстоятельство приводит к удвоению радиационных потерь в условиях трехлучевой компланарной дифракции. Действительно, вычисляя силу торможения частицы собственным полем излучения

 $F = \left(e\mathbf{v}/v(2\pi)^4\right) \iiint \mathbf{E}_0(k_0,\omega) d^3k_0 d\omega,$ 

$$d^3k_0 
ightarrow heta d heta d\phi rac{\omega_B^2}{vc^2} d\omega$$

где





и учитывая при обходе полюса  $\theta = \theta_0$ , т.е. если переменная интегрирования  $\theta$  имеет малую мнимую положительную составляющую, то полюс обходится сверху, что сводится к умножению на  $-\pi i$ , для дифференциальной по азимуту спектральной плотности радиационных потерь получаем

$$\frac{d^2 W_s}{d\omega d\phi} = e^2 g^2 \omega_B p_s^2 c_s^2 |\nu|^3 / \pi c^2 \left(\nu^2 + 3z_0 \cos^2 \phi\right)^2.$$
(4)

С приближением к азимуту  $\phi = \pi/2$  угол испускания  $\theta_0$  начинает значительно превышать характерную величину  $\sqrt{z_0} \sim \sqrt{|g|}$ , однако интенсивность излучения для рассматриваемых частот  $\nu \sim \sqrt{|g|}$ , как следует из (4), по-прежнему оказывается порядка  $e^2g^2\omega/c^2\sqrt{z_0}$  (рис. 2). Узкая область азимутов  $|\phi \pm \pi/2| \lesssim \sqrt{|g|}$  дает малый вклад в интеграл в пределах от  $-\pi$  до  $\pi$ .



Поэтому интегрированием (4) приходим к следующим спектральным распределениям

$$dW_{\sigma}/d\omega = I \left(1 + \nu^2/3z_0\right)^{-1/2}, \quad I = e^2 g^2 \omega_B/c^2 \sqrt{3z_0},$$
$$dW_{\pi}/d\omega = E\nu^2/12z_0 \left(1 + \nu^2/3z_0\right)^{3/2}.$$
 (5)

Найденные зависимости, как и ожидалось, вдвое превышает спектральные распределения двухлучевой дифракции параметрического излучения, причем максимум  $dW_{\pi}/d\omega$  достигается при  $\nu = \nu_m = \sqrt{2r_0/3}$  (сплошные кривые на рис. 3). По аналогии можно ожидать, что открытие нового канала для излучения в условиях четырехлучевой дифракции приведет к утроению радиационных потерь, а в условиях шестилучевой дифракции радиационные потери будут в среднем в пять раз выше.

Анализ значительно усложняется вблизи брегтовской частоты  $\omega_B$ , когда  $\nu \sim |g|$ . Угол испускания излучения оказывается значительно меньше типичных значений  $\sim \sqrt{|g|}$ , если  $|\phi \pm \pi/2| \gtrsim \sqrt{|g|}$ ,

$$\theta_0 = \left[ (\nu - c_s^2 g^2 / z_0)^2 - c_s^2 g^2 (1 + c_s g / z_0)^2 \right]^{1/2} / \sqrt{3} |\cos \phi| \sim |g|.$$
(6)

Важнейшим следствием (6) является существование интервалов частот, где  $\theta_0^2 < 0$ , запрещенных для излучения по всему конусу (за исключением симметричных точек с азимутами  $\pm \frac{\pi}{2}$ ),  $\nu_- \leq \nu \leq \nu_+$ . Для  $\sigma$ -поляризации  $\nu_- = g$ ,  $\nu_+ = -g - 2g^2/z_0$ ; для  $\pi$ -поляризации  $\nu_+ = -g/2$ ,  $\nu_- = g/2 - g^2/2z_0$ . В указанном интервале частот  $d^2W/d\omega d\phi = 0$  (рис. 2), а вне его интенсивность излучения мала  $(-e^2\omega g^2\nu^3/c^2z_0^2)$ .



В узкой области азимутов вблизи  $\pm \pi/2$  границы  $\nu_{\pm}$  начинают зависеть от  $\phi$ , что приводит к "размытию" запрещенной для излучения зоны. Рассмотрим более детально точку с азимутом  $\phi = \pi/2$ . Предварительно нормируем величины  $\theta^2$ ,  $\nu$ , g на положительную константу  $z_0$ , а соответствующие нормированные величины обозначим через x,  $\nu_1$ ,  $g_1$ . Тогда для квадрата угла испускания x находим два значения

$$x_{3} = \left[\nu_{1} + g_{1} - 1 + \sqrt{(\nu_{1} + g_{1} + 1)^{2} + 8g_{1}^{2}}\right] / 2,$$

$$x_{4} = \nu_{1} - g_{1}.$$
(7)

Соответствующий угол  $\theta_4$  не дает вклада в потери, поскольку  $E_0(\theta_4) = 0$ . Отметим, что для рассматриваемых частот  $\nu_1 \sim 1$ ,  $x_3 \sim 1$ , т.е. угол испускания излучения  $\theta_3 \sim \sqrt{z_0}$ . Дифференциальную по азимуту спектральную плотность находим по аналогичной (4) схеме

$$\frac{d^2 W_{\sigma}}{d\omega d\phi} = e^2 \omega_B g^2 x_3 / \pi z_0 c^2 (1+x_3) \times \sqrt{(\nu_1 + g_1 + 1)^2 + 8g_1^2}.$$
 (8)

Максимум частотной зависимости (8) оказывается порядка  $e^2 \omega g^2/c^2 z_0$ , а его узость  $\sim z_0 \sim 10^{-5}$  (рис. 2). Таким образом, оказываясь на два-три порядка более узким, максимум спектрального распределения (8) становится вместе с тем на два-три порядка выше по сравнению с другими направлениями на конусе. Это приводит ко вкладу в спектральную плотность, сравнимую с (5), а также к смещению максимума спектрального распределения вправо от брегговской частоты (рис. 3), т.е. к значительной асимметрии спектрального распределения.

С целью более корректного учета вклада областей  $|\phi \pm \pi/2| \lesssim \sqrt{z_0}$  в спектральную плотность радиационных потерь проведем вначале интегрирование по азимуту  $\phi$ , а затем по полярному углу  $\theta$ . Основной вклад вблизи брегговской частоты  $\omega_B$  дает  $\sigma$ -поляризация, поскольку (при  $\phi = \pi/2$ )  $p_{\pi} = 0$ , так что узкий максимум (рис. 2) для  $\pi$ -поляризации отсутствует. Зависимость



азимута  $\phi$  от полярного угла  $\theta$  на конусе излучения находим из (2)

$$\cos^2 \phi = z_0 (x - \nu_1 + g_1) \left( z - \nu_1 - g_1 - 2g_1^2 (1 + x)^{-1} \right) / 3x.$$
(9)

Для разных частот излучения зависимость  $\cos^2 \phi$  от x иллюстрируется на рис. 4, где  $x_1 = z_0(\nu - \nu_-)(\nu - \nu_+)/3$ , а точки  $x_3$ ,  $x_4$ , отвечающие  $\phi = \pm \pi/2$ , находятся с помощью соотношений (7). Отметим, что с уменьшением частоты  $\nu_1$  вначале обращается в нуль  $x_3$  (при  $\nu = \nu_+$ ), а затем и  $x_4$  (при  $\nu = \nu_-$ ) (рис. 4). Таким образом, в зависимости от частоты спектральная плотность будет выражаться через один или два интеграла

$$\frac{dW_{\sigma}}{d\omega} = \begin{cases} I \int\limits_{x_{1}}^{x_{3}} f_{1}f_{2}dx + I \int\limits_{x_{4}}^{3/z_{0}} f_{1}f_{2}dx, \quad \nu \geqslant \nu_{+}, \\ I \int\limits_{x_{4}}^{3/z_{0}} f_{1}f_{2}dx, \quad \nu_{-} \leqslant \nu \leqslant \nu_{+}, \\ I \int\limits_{x_{1}}^{x_{4}} f_{1}f_{2}dx, \quad \nu \leqslant \nu_{-}, \end{cases}$$
(10)

где  $f_1 = (x - \nu_1 + g_1)^{1/2} (x - \nu_1 - g_1 - 2g_1^2 (1 + x)^{-1})^{-1/2},$  $f_2 = 2(x - x_1)^{1/2} / \pi (1 + x)^2.$ 

Поскольку  $f_1(x) < 1$ , то для интересующих нас значений  $\omega$  вблизи брегговской частоты  $\omega_B$ , например  $\nu = \nu_-$ , из (10) немедленно следует, что  $dW/d\omega < I$ . Более точные оценки показывают возможность понижения максимума по сравнению с I более чем на 15–20%. Таким образом, запрещенная для излучения область частот проявляется также и в интегральной характеристике — спектральной плотности излучения (рис. 3). В частности, при проведении численных расчетов вблизи  $\omega_B$  нужно уменьшать шаг следования на один–два порядка.

Если границы тонкого кристалла перпендикулярны скорости частицы (рис. 1), то для получения интенсивностей излучения в направлениях  $k_1$ ,  $k_2$  следует соответствующие характеристики (4), (5), (8), (10) умножить на L/2, где L — толщина кристалла. Разумеется, суммарная интенсивность излучения, поделенная на L, будет совпадать с радиационными потерями с единицы длины.

## Список литературы

- Адищев Ю.В., Мун В., Углов С.Р. Матер. XVII Всесоюз. совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами. М., 1988. С. 99–100.
- [2] Афанасенко В.П., Барышевский В.Г., Зуевский Р.Ф. и др. // Матер. XX Всесоюз. совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами. М., 1991. С. 112–114.
- [3] Feranchuk I.D., Ivashin A.V. // J. Physigue. 1985. Vol. 46. N 11. P. 1981–1986.
- [4] Шипов Н.В. Изв. вузов. Радиофизика. 1985. Т. 28. № 8. С. 1043–1052.
- [5] Truong Ba Ha, Dubovskaya I. // Phys. Stat. Sol. (b). 1991. Vol. 155. P. 685–690.
- [6] *Пинскер З.Г.* Рентгеновская кристаллооптика. М.: Наука, 1982. 390 с.